

## Séminaire Moyens de Caractérisation CERTeM 2014

*Une CERTeM idée*



*de la Science*



En novembre dernier un séminaire scientifique CERTeM a été organisé sur le thème des moyens d'analyse technologique avec un programme riche et varié : Caractérisation Electrique, Caractérisation Mécanique (Testeur micro et nano scratch), Imagerie de surface (microscope confocal, holographique), la Diffraction X et la Microscopie Electronique en Transmission. Compte tenu du succès qu'a rencontré cette session, nous avons décidé d'organiser cette année un nouveau séminaire sur ce sujet.

Ce séminaire aura lieu le **mercredi 9 Juillet 2014 de 14h à 17h30 en salle Indre à ST-Tours** et sera articulé autour des 5 moyens de caractérisation suivants :

- **Les méthodes d'analyse élémentaire de surface (SIMS et XPS)**, Roland BENOIT, CRMD
- **La Microscopie Atomique en champ proche (AFM)**, Damien VALENTE, GREMAN
- **La spectroscopie Raman**, Mustapha ZAGHRIQUI, GREMAN
- **La diffusion des rayons X aux petits angles (SAXS & GISAXS)**, Pascal ANDREAZZA, Nathalie COHAUT, CRMD
- **Le Microscope Electronique à balayage combiné à un faisceau d'ions focalisé (FIB-SEM)**, Nicolas VIVET, STMicroelectronics.

Afin que ce séminaire soit bénéfique pour le plus grand nombre, chacune des présentations (30 min max) comportera une description pédagogique de la technique / équipement et sera suivie d'une synthèse scientifique plus pointue sur les travaux en cours. Nous avons également planifié un délai suffisant entre les présentations afin que chacun puisse adresser ses questions aux spécialistes de ces techniques.

En résumé, ce séminaire vous permettra de découvrir (ou redécouvrir) les moyens de caractérisation que possèdent le CERTeM, et vous permettra de discuter de vos problématiques avec de nombreux spécialistes des techniques de caractérisation.



*Pour les personnes extérieures à ST Tours ne possédant pas de badge, merci de confirmer votre présence à [magalie.leger-ext@st.com](mailto:magalie.leger-ext@st.com) et [nicolas.vivet@st.com](mailto:nicolas.vivet@st.com)*